

 <b>Fachhochschule Jena</b> University of Applied Sciences Jena Fachbereich Elektrotechnik / Informationstechnik	<b>Elektrische Meß- und Prüftechnik</b> <b>Laborpraktikum</b>	<b>Versuch C</b> ET(BA) WS 2010/2011
<b>Oszilloskop</b>		
Set: <u>3.08</u> Studienrichtung: <u>KMT</u> Teilnehmer: <u>Michael Goldbuch</u> <u>Jürgen Döffinger</u>	<b>Testat:</b> ..... Verantwortlicher: <u>Niobel</u> Datum: <u>21.12.10</u> <u>Wolf</u> Unterschrift	

## 1 Aufgabenstellung

Ziel dieses Versuches ist die Diskussion der physikalischen und technischen Grenzen welche eine Vergrößerung der Bandbreite von Oszilloskopen erschweren bzw. verhindern. Die Notwendigkeit der Frequenzkompenstation in Tastköpfen wird betrachtet und Maßnahmen zur Verringerung der kapazitiven Belastung des Meßobjektes untersucht. Weiterhin lernen Sie die Möglichkeit kennen, mit dem bereitgestellten Funktionsgenerator verschiedene Möglichkeiten der Modulation eines Trägersignals zu nutzen. Als Möglichkeit der Darstellung der Kurvenform von Signalen mit einer Frequenz weit oberhalb der Bandbreite des Oszilloskops wird die Anwendung des Sampling-Prinzips untersucht. Mittels der Frequenzmodulation im Betriebsmodus **VCG** ( Voltage Controlled Generator ) wird untersucht wie Gleichspannungen in Frequenzen umgesetzt werden um weiter durch eine zeitlich veränderbare Steuerspannung die Frequenzmodulation einer kontinuierlichen Trägerschwingungen zu erreichen. Ein praktischer Anwendungsfall ist die Darstellung von Übertragungsfunktionen mittels "Wobbeln".

**EINGEGANGEN**

**15. DEZ. 2010**

**Erlied**

## 2 Versuchsvorbereitung

- 2.1 Aus welchen Baugruppen besteht ein Oszilloskop?
- 2.2 Was ist die Bandbreite eines Oszilloskops und welche Testsignale sind für die Ermittlung der Bandbreite des Oszilloskops geeignet?
- 2.3 Was verstehen Sie unter „Triggern“ ?
- 2.4 Warum werden bei bestimmten Messungen mit dem Oszilloskop Tastteiler verwendet?
- 2.5 Was verstehen Sie unter Frequenzkompenstation?  
Wie wird diese im 10:1 Tastteiler eines Oszilloskops realisiert?
- 2.6 Welche ohmschen und kapazitiven Belastungen des Meßobjektes treten beim Messen mit dem Oszilloskop auf, wir wirken diese und wie kann man sie verringern?
- 2.7 Erläutern bzw. erklären Sie den Begriff : „Sampling“ !  
Wo liegen die Vorteile der Sampling-Messtechnik ?  
Wie funktioniert das Prinzip der Frequenztransformation und welche Unterschiede bestehen zwischen real-time-sampling, equivalent-sampling und random-sampling ?
- 2.8 Welche Forderungen ergeben sich aus dem Abtasttheorem von Shannon, damit die abgetasteten Signale wieder rekonstruiert werden können?
- 2.9 Leiten Sie die Formel für die Funktion  $u = f(t)$  her, wenn Sie eine Trägerschwingung  $u_1(t) = \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega_1 t)$  mit einer niederfrequenten Sinusschwingung  $u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega_2 t)$  modulieren. Dabei wird Amplitudenmodulation verwendet und es gilt  $\omega_1 \geq 10\omega_2$  !

### 3 Versuchsdurchführung

#### 3.1 Frequenzkompensation des Eingangsteilers

- Ermitteln Sie die Schaltung der wirksamen Bauelemente des vorgegebenen Tastteilers und bestimmen Sie deren Parameter.
- Führen Sie die Frequenzkompensation praktisch durch !  
Benutzen Sie dazu die im Oszilloskop vorhandene Kalibrierquelle.
- Verlängern Sie nach erfolgter Frequenzkompensation das Koaxialkabel zwischen Tastkopf und Oszilloskop um etwa 50 cm.  
Ist eine erneute Kompensation erforderlich?  
Wenn ja ist sie möglich ?  
Begründen Sie Ihre Antwort !

#### 3.2 Bestimmung der Bandbreite des Oszilloskops Hameg HM 205-3

- Ermitteln Sie aus der Sprungantwort die obere Grenzfrequenz des Oszilloskops (Tastkopf + Eingang des Oszilloskops).

**Hinweis:**

Verwenden Sie statt der Zeitkonstante  $\tau$  (die bei der mathematischen Behandlung der Sprungantwort eingeführt wurde) die Anstiegszeit  $T_{Anstieg}$ .

Es gilt :

$$T_{Anstieg} = \frac{0,35}{f_{Grenz}}$$

- Ermitteln Sie bei Wechselspannungskopplung (AC ohne 10:1 Tastkopf) die untere Grenzfrequenz des Oszilloskops aus der Dachschräge einer auf dem Oszilloskopschirm dargestellten Rechteckspannung !

**Hinweis :** Die Dachschräge ist definiert als Amplitudenabfall während der Impulsdauer.

Es gilt :

$$D = 1 - e^{-\frac{f_u}{f}} \quad \text{wobei} \quad D = \frac{\Delta U}{U_{max}}$$

#### 3.3 Simulation eines Sampling - Oszilloskops

- Simulieren Sie die Wirkungsweise eines Sampling-Oszilloskops, indem Sie mit dem Funktionsgenerator zunächst Rechteck - Pulse mit einem möglichst kleinem Tastverhältnis erzeugen und diese auf dem Oszilloskop darstellen.
- Überprüfen Sie experimentell das Theorem von Shannon, indem Sie eine Sinus-Schwingung von 1kHz mit Hilfe der unter a) erzeugten Rechteckpulse abtasten.

**Anmerkung:**

Der Funktionsgenerator besitzt die Möglichkeit die Amplitude des erzeugten Ausgangssignals durch ein internes Sinussignal von 1kHz zu modulieren. Dadurch wird die abgetastete Sinus-Schwingung punktweise dargestellt.

- Stellen Sie die Schirmbilder für die Tastfrequenzen von 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz und 10 kHz nacheinander auf dem Oszilloskop dar und Skizzieren Sie auch diese Oszillogramme im Versuchsprotokoll ! Diskutieren Sie die Ergebnisse im Hinblick auf das Shannon-Theorem und die Anwendbarkeit dieser Methode bei Sampling-Oszilloskopen.

#### 3.4 Amplitudenmodulierte Schwingung

- Bilden Sie auf dem Oszilloskop eine unmodulierte Trägerschwingung  $u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$  ab.  
Beobachten Sie auf dem Oszilloskop den Einfluß einer dem Generator extern (Rückseite des Gerätes) zugeführten Gleichspannung von  $-5V < U_s < +5V$  auf die dargestellte Trägerschwingung.  
Skizzieren Sie vor der Messung das Blockschaltbild für diese Aufgabe !
- Bilden Sie eine mit 1kHz amplitudenmodulierte Trägerschwingung  $u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$  ab.  
Benutzen Sie dazu die interne 1kHz-Sinusquelle des Funktionsgenerators.  
Beobachten Sie auf dem Oszilloskop den Einfluß der Amplitude der 1kHz-Schwingung auf die

Amplitude der Trägerschwingung!  
Skizzieren Sie das Bild im Protokoll!

- c) Diskutieren Sie Ihre Beobachtungen aus a) und b).

### 3.5 Frequenzmodulierte Schwingungen

- a) Nehmen Sie den Verlauf  $f = f(U_{\pm})$  auf!

Stellen Sie bei  $U = 0 \text{ V}$  eine geeignete Frequenz im kHz-Bereich ein. Verändern Sie die Gleichspannung  $U_{\pm}$  im Bereich von  $-10 \text{ V} < U_{\pm} < +10 \text{ V}$  und skizzieren Sie Ihre Ergebnisse in einem Diagramm.

Welcher Gleichspannungsbereich ist für die Frequenzmodulation ausnutzbar?

- b) Benutzen Sie an Stelle einer modulierenden Sägezahn - Zeitfunktion (Rampenfunktion) am VCG - Eingang die interne Sweep - Funktion des Funktionsgenerators zur Erzeugung des für das Wobbeln notwendigen Frequenzhubes.
- c) Nehmen Sie nach dem Wobbelverfahren die Amplituden-Frequenz-Kennlinie von verschiedenen Versuchsobjekten auf!

## 4 Literaturhinweise:

### Richter

Grundlagen der elektrischen Meßtechnik  
Verlag Technik Berlin 1988

### Käs; Pauli

Mikrowellentechnik  
Franzis-Verlag München 1991

### Meyer, G.

Oszilloskope; Hüthig-Verlag, Heidelberg 1989

### Tränkner, H.-R.

Taschenbuch der Meßtechnik; Oldenbourg, München. Wien 1990

### Schmusch, Wolfgang

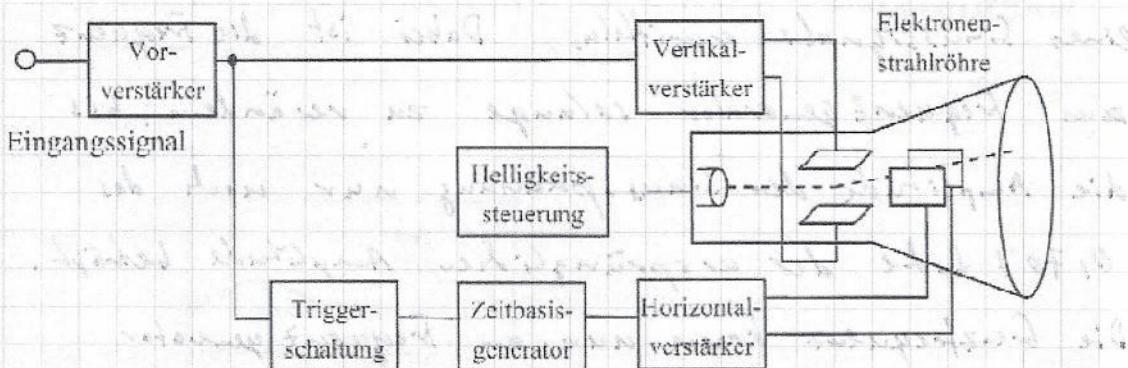
Elektronische Meßtechnik ; Vogel Buchverlag; 5. Auflage 2001  
ISBN 3-8023-1884-6

### Hoffmann, Jörg

Taschenbuch der Meßtechnik ; 3. Auflage Fachbuchverlag Leipzig; 2002  
ISBN 3-446-21977-3

# Versuchsvorbereitung

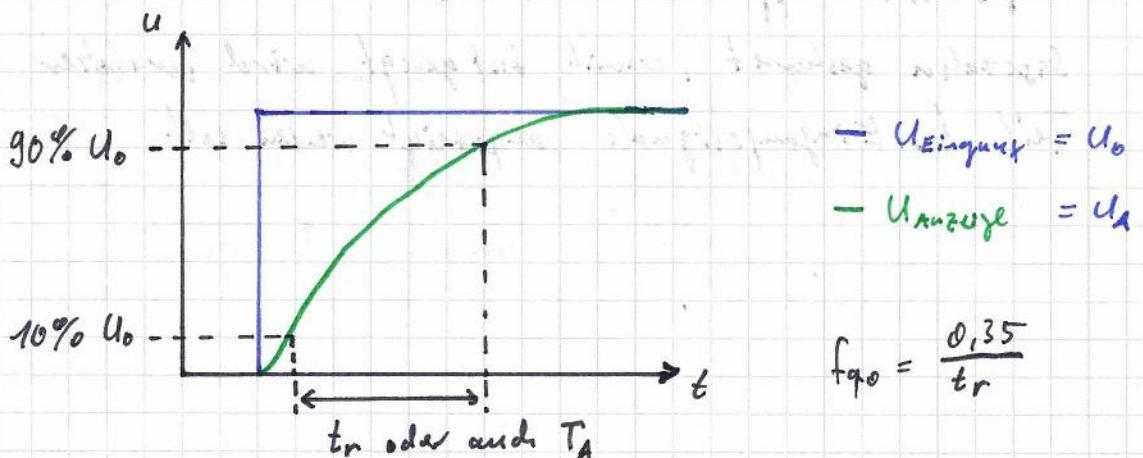
2.1.



sehr schlicht - das Wesentliche

2.2.

Die Bandbreite wird von der oberen Grenzfrequenz  $f_{q0}$  bestimmt. Im Gleichspannungsbereich existiert keine untere Grenzfrequenz. Die obere Grenzfrequenz  $f_{q0}$  bestimmt sich aus  $f_{q0} = \frac{0,35}{t_r}$ . Dabei ist  $t_r$  die Anstiegszeit zwischen 10% und 90% der Eingangsspannung. Dabei wird als Eingangssignal ein Rechtecksignal eingespielt.



*Frage: Welche Ausprägung hat die Bandbreite auf die Einsatztiefe des Osz.*

Somit ergibt sich für die Bandbreite  $B = f_{q0} - 0\text{Hz}$ .

Daraus folgt:  $B = f_{q0} = \frac{0,35}{t_r}$ .

Eine weitere Möglichkeit der Bestimmung der oberen Grenzfrequenz und damit der Bandbreite lässt sich mithilfe eines Sinussignals ermitteln. Dabei ist die Frequenz am Frequenzgenerator solange zu verändern, bis die Amplitude der Sinusspannung nur noch das 0,707-fache der ursprünglichen <sup>x)</sup> Amplitude beträgt.

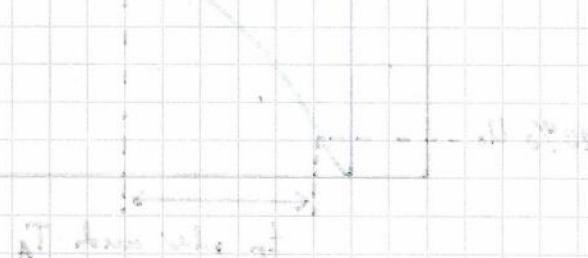
Die Grenzfrequenz kann nur am Frequenzgenerator abgelesen werden oder über die Periodendauer am Oszilloskop bestimmt werden.

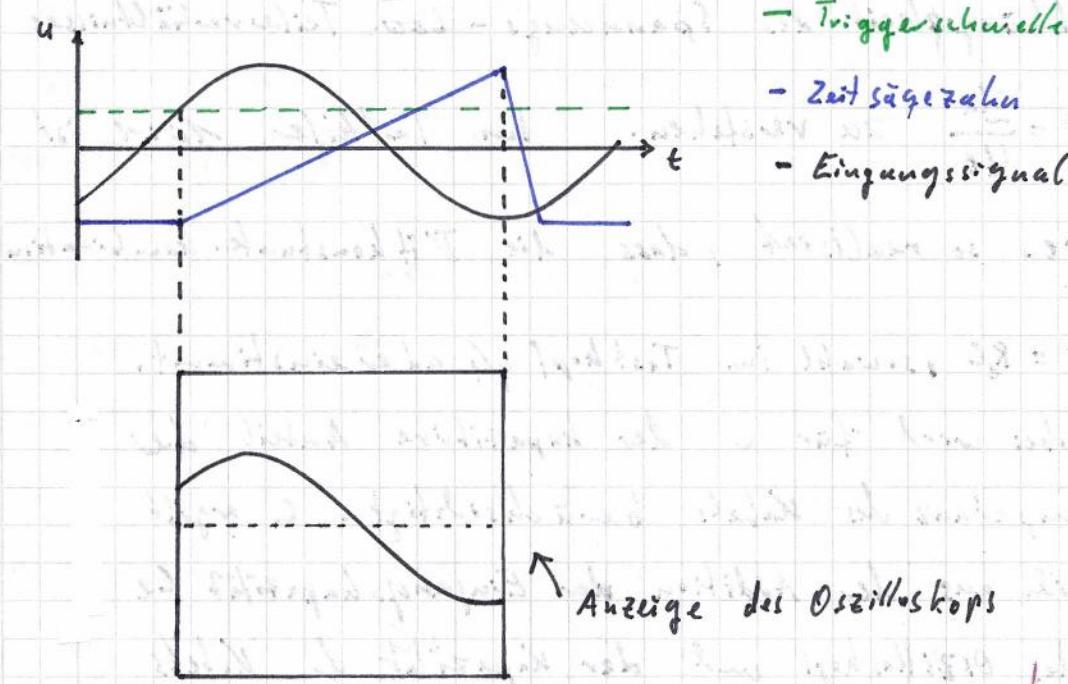
<sup>x)</sup> Bei welcher Frequenz kommt es?

### 2.3.

In Verbindung mit der Zeitverzögerung am y-Kanal und der Zeitbasiseinheit werden mithilfe der Trigger-Schaltung die zeitlichen Abläufe im Oszilloskop gesteuert.

Durch einstellen der Triggerschwelle wird festgelegt wann der Sägezahn der Zeitbasiseinheit gestartet wird. Erst wenn das Eingangssignal die eingestellte Triggerschwelle überschreitet wird der Sägezahn gestartet, womit festgelegt wird, welcher Teil des Eingangssignals angezeigt werden soll.



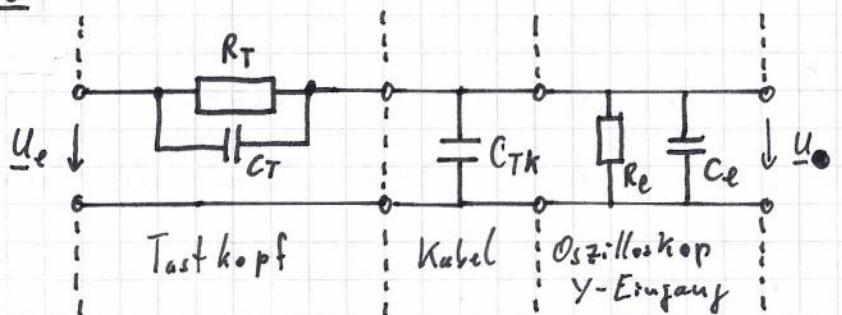


→ ermöglicht erst stehendes Bild!

#### 2.4.

Testleiter werden verwendet, um die kapazitive und ohmische Belastung der Signalquelle zu vermindern. Sie werden aber auch dazu verwendet, um höhere Spannungen messen zu können. Dies wird durch die verminderte Empfindlichkeit erreicht.

#### 2.5.



Unter Frequenzkompensation ist die Wahrung der Frequenzabhängigkeit des Spannungs - bzw. Teilerverhältnisses

$$\underline{V} = \frac{\underline{U}_e}{\underline{U}_0} \text{ zu verstehen. Im Tastteiler } 10:1 \text{ ist}$$

dies so realisiert, dass die Zeitkonstanten Kombination

$$\tau = R_e C, \text{ mit der im Tastkopf übereinstimmt.}$$

Dabei wird mit  $C$  der kapazitive Anteil der Impedanz des Kabels berücksichtigt.  $C$  ergibt sich aus der Addition der Einfangskapazität  $C_e$  des Oszilloskops und der Kapazität des Kabels  $C_{TK}$ . Somit ergibt sich:  $C = C_e + C_{TK}$ .

Aus den zuvor genannten Kriterien ergibt sich für den Frequenzkompensierten Zustand das Verhältnis

$$R_e C = R_T C_T.$$

## 2.6.

Beim Messen mit dem Oszilloskop wird über den ohmschen Widerstand und den kapazitiven Anteil des Eingangsteils des Oszilloskops das Messobjekt beeinflusst.

Ist der Widerstand des Oszilloskops nicht wesentlich größer als der des Messobjektes, entsteht ein nicht vernachlässigbarer Spannungsfehler. Dies kann durch zuschalten eines weiteren Widerstandes in Reihe zum ohmschen Widerstand des Oszilloskops entgegengewirkt werden. Bei der Messung ist dieser dann bei der Berechnung des Messwertes zu berücksichtigen.

(Wenn vernachlässigbar, dann berücksichtigen?)

Wie oben schon beschrieben, nimmt auch der kapazitive Anteil des Eingangsteils des Oszilloskops einen Einfluss auf das Messobjekt. Dies wirkt sich wie ein Tiefpass aus, d.h. die obere Grenzfrequenz des Messobjektes heruntergesetzt wird, da eine Parallelschaltung der Kapazität des Messobjektes und des Oszilloskops zustande kommt und somit die Gesamtkapazität des Messobjektes erhöht wird.

Durch Zuschalten einer weiteren Kapazität in Reihe kann die Gesamtkapazität wieder heruntergesetzt werden.

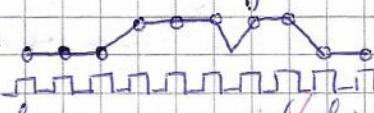
Diese Anordnungen erfüllt beispielsweise ein Testfeilen.

2.7. Sampling beschreibt das Abtasten einer  
Ferngröße, bzw. des Signals einer Ferngröße zu  
bestimmten Zeiten. Ein Signal wird somit nicht ~~immer~~ wiederholt  
durchgängig abgetastet. Man erhält „nur“ einige  
Proben / Samples und zerlegt das Signal in einzelne Punkte,  
welche entweder direkt ausgegeben werden, oder gespeichert  
und später ausgegeben werden.

Ein Vorteil ist die Nutzung der Sampling-Methode zur  
Analog-Digital Wandler. So kann bei einem Digital-  
Speicher-Oszilloskop die Nachbearbeitung (bzw. Auswertung)  
auf externen Geräte geschehen. Ebenso können einmalige,  
niedrige Frequente und nicht periodische Signale nicht bar gemacht  
werden. DSOs ermöglichen auch die planarfreie Darstellung  
von Signalen mit geringer Wiederholrate.

Die bessere Darstellung kann durch eine Frequenztransformation  
erfolgen. Hierbei wird ein Signal in seine Frequenz (bzw.  
Periodendauer) geändert ohne jedoch die Signalform zu ändern.  
Das Signal wird also gedehnt.

Beim Sampling unterscheidet man verschiedene Arten.  
Im Real-Time-Sampling wird das Signal nach einem  
bestimmten Takt abgetastet:



Der Kurvenverlauf wird direkt aufgenommen und gleich ausgetragen.)

Vorteil ist die Aufnahmemöglichkeit von einmaligen Ereignissen.

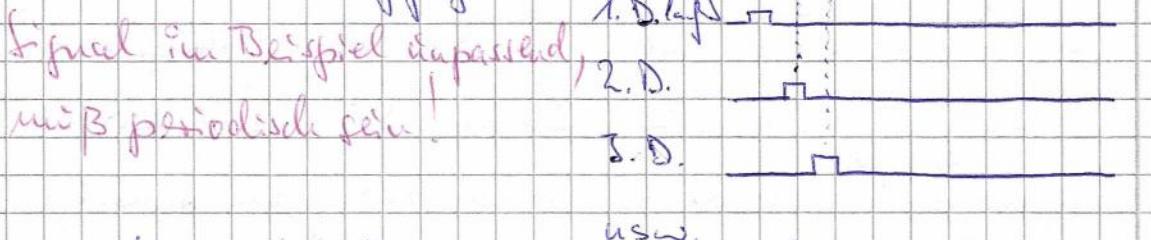
Nachteil ist die Begrenzung des Abtastabstandes. Es können  
Informationen verloren gehen, z.B. wenn (schnelle) Vorgänge  
zwischen zwei Taktzeiten stattfinden.

Sollte es sich um ein periodisches Signal handeln, führt  
nicht das eingeschränkt-Sampling an.

Man kann auch gespeichert und weiterverarbeitet werden!

Beim Äquivalenzsampling geschieht die Abtastung in mehreren Durchläufen. Pro Durchlauf einer Signalperiode werden ein oder mehrere (wenige) Punkt(e) abgetastet.

Man unterscheidet im sequentiell sampling und random-sampling. Beim sequentiellen sampling durchläuft man die Periode mehrfach und addiert bei jedem Durchlauf eine kleine Zeit zur vorhergegangenen Abtast-



Die Werte werden abgespeichert und "später" als Ganzes angegeben.

Bei Random-Sampling werden die Abtastpunkte zufällig gewählt. Zur zählerischen Zuordnung werden die Zeiten zwischen Triggerzeit und Abtastwert gemessen. Im Unterschied zu den beiden anderen Verfahren werden (bzw können hier) Fehler (systematische Fehler) vermieden werden, da es sich nicht um feste Abstände zwischen den Abtastpunkten handelt.

## 2. 8.

Das Abtasttheorem von Shannon erklärt wie oft ein Signal abgetastet werden muß damit es rekonstruierbar ist und keine falschen, bzw verfälschten, Signale.

bei der Rücktransformation oder der Ausgabe entstehen.

Im Grenzfall muß die Abtastzeit ~~zu~~ klein sein, als eine halbe Periode. Doch auch hier können noch

Fehler entstehen. Deshalb ist es ratsam  $\Delta t \approx 1/(2,5 \dots 3) \text{ fs}$

oder sogar  $\Delta t \approx 1/(5 \dots 10) \text{ fs}$  zu wählen]

- periode!

schließt nicht nun  
Shannon fließen!

2. 9.

$$\text{Trägerschwingung: } u_1(t) = \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega_1 t)$$

$$\text{modulatorisch Schwingg.: } u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega_2 t)$$

$$\omega_1 \geq 10\omega_2$$

ges:  $u = f(t) \Rightarrow u_1(t)$  verändert durch  $u_2(t)$

$$u = (\hat{u}_1 + \hat{u}_2 \sin(\omega_2 t)) \cdot \sin(\omega_1 t)$$

$$u = \hat{u}_1 \sin(\omega_1 t) + \hat{u}_2 \sin(\omega_2 t) \cdot \sin(\omega_1 t)$$

$$u = \hat{u}_1 \sin(\omega_1 t) + \frac{\hat{u}_2}{2} \cos(\omega_2 t - \omega_1 t) - \frac{\hat{u}_2}{2} \cos(\omega_2 t + \omega_1 t)$$

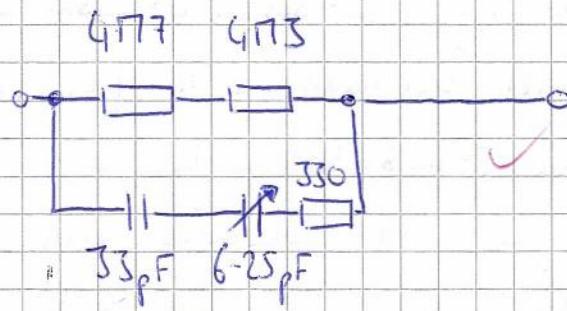
f

für  $\omega_1 \gg \omega_2$  ergibt sich eine negative Frequenz

3.

3.1.

a)



- c) Eine erneute Kompenstation ist erforderlich da das Kabel eine weitere Kapazität addiert. Die neue verstärkte Variante ist unterkomponierbar.  
Ein erneuter Abgleich war nicht möglich. Die Kapazität des TK reichte nicht aus um eine Kompenstation zu ermöglichen.

3.2.

$$a) T_A = \frac{0.35}{f_{\text{erranz}}} \quad f_{\text{erranz}} = f_0 \quad T_A = 50 \text{ ns}$$

$$f_0 = \frac{0.35}{T_A} = \frac{0.35}{2.5 \cdot 0.2 \mu\text{s} \cdot \frac{1}{10}} = 7 \text{ MHz}$$

$$b) D = 1 - e^{-\frac{T_A}{\tau}} \quad D = \frac{\Delta u}{U_{\max}}$$

$$f_u = \frac{1}{\pi} \ln \left( \frac{1}{1-D} \right)$$

$$\rho = 16 \text{ Hz}$$

$$\Delta u = 2 \text{ V}$$

$$U_{\max} = 6.8 \text{ V}$$

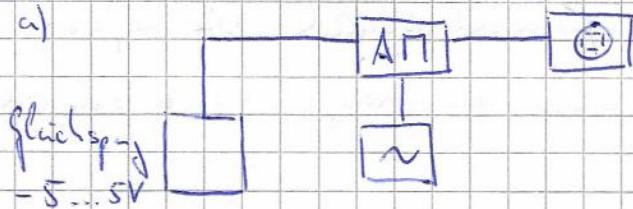
$$f_u = 1.5 \text{ Hz}$$

3.3.

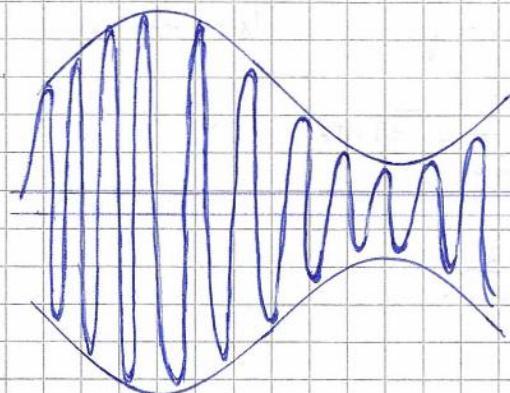
- c) Bei 10 kHz war der Sinus am besten erkennbar und die Periodendauer korrekt. Bei niedrigerer Trägerfrequenz verschlechterte sich die Erkennbarkeit so dass es zu Überlagerungs-, Sprüngen und Unzähligkeiten. Das Shannon-Theorem beschreibt den Grenzfall. Jedoch zeigt der Versuch das eine deutlich höhere Frequenz ausreicht, bzw. zur eindeutigen Bestimmung notwendig ist.

3.4.

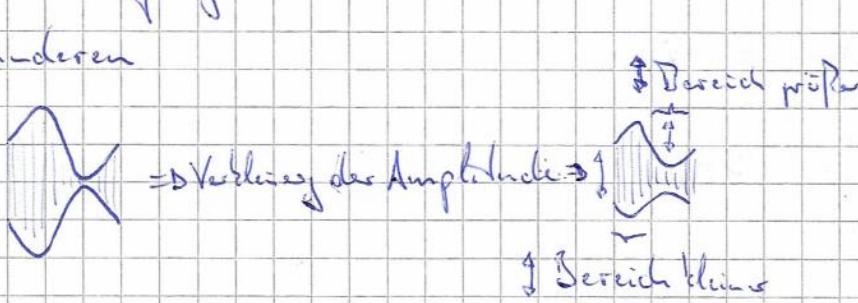
a)

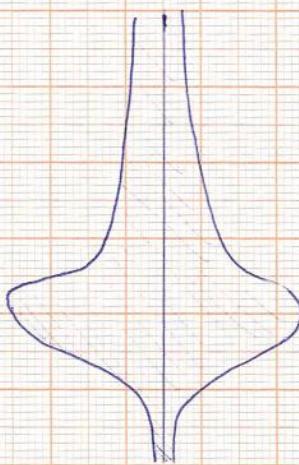
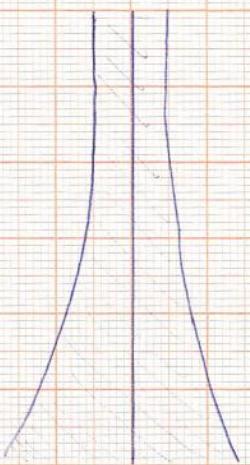
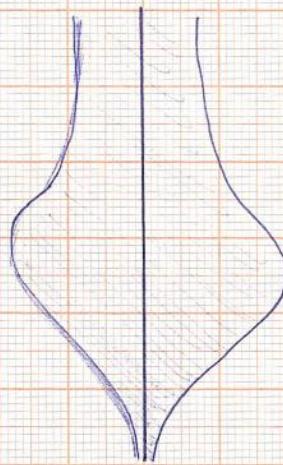


b)



- c) Die modulierende Spannung fungiert als Einhüllende. Je größer die Amplitude wird desto mehr dehnt die modulierende das Trägersignal in einen Bereich und sticht es in einen anderen.



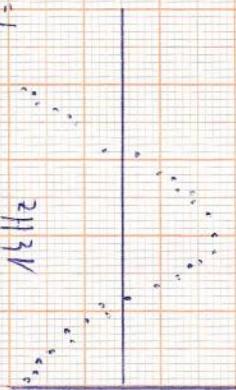


3.5

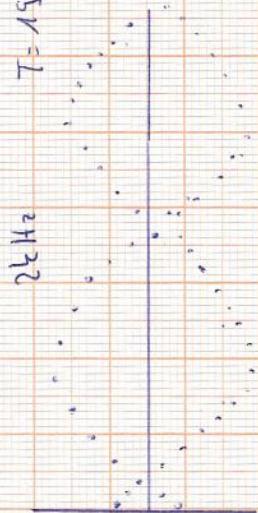
$$T = 35 \text{ ms}$$



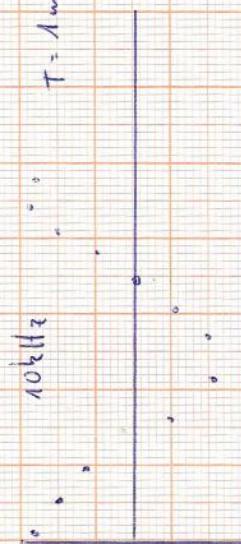
$$T = 45 \text{ ms}$$



$$T = 15 \text{ ms}$$



$$T = 1 \text{ ms}$$



3.5

